

1998年:「X線応力測定法の基礎と最近の発展」

1. X線応力測定法の基礎, 後藤徹, 大谷眞一, Vol.47, No.11, pp.1188-1194.
<https://doi.org/10.2472/jsms.47.1188>
2. ミクロ応力とマクロ応力, 田中啓介, 秋庭義明, Vol.47, No.12, pp.1301-1307.
<https://doi.org/10.2472/jsms.47.1301>
3. 表面応力・集合組織材, 英崇夫, Vol.48, No.1, pp.89-95.
<https://doi.org/10.2472/jsms.48.89>
4. X線回折法の実機への適用, 林眞琴, 井上靖雄, Vol.48, No.2, pp.198-204.
<https://doi.org/10.2472/jsms.48.198>
5. 新素材への適用, 鈴木賢治, 日下一也, Vol.48, No.3, pp.308-314.
<https://doi.org/10.2472/jsms.48.308>
6. 新しい測定技術, 吉岡靖夫, 林眞琴, 佐々木敏彦, Vol.48, No.4, pp.410-415.
<https://doi.org/10.2472/jsms.48.410>

2005年:「新しい光源による応力評価」

1. 高エネルギー放射光による内部応力分布測定, 鈴木賢治, 田中啓介, Vol.54, No.5, pp.553-558.
<https://doi.org/10.2472/jsms.54.553>
2. シンクロトロン放射光による薄膜および微小部の応力測定, 英崇夫, 秋田貢一, Vol.54, No.6, pp.642-647.
<https://doi.org/10.2472/jsms.54.642>
3. 中性子回折法による応力測定, 秋庭義明, Vol.54, No.7, pp.785-790.
<https://doi.org/10.2472/jsms.54.785>
4. 中性子応力測定の実機への適用, 大城戸忍, 盛合敦, Vol.54, No.8, pp.895-900.
<https://doi.org/10.2472/jsms.54.895>

2009年:「回折法による材料評価の新しい展開」

1. 溶接残留応力とX線残留応力測定, 栗村隆之, 秋庭義明, Vol.58, No.10, pp.873-878.
<https://doi.org/10.2472/jsms.58.873>
2. 高エネルギー放射光による応力測定, 菖蒲敬久, 柴野純一, Vol.58, No.11, pp.948-954.
<https://doi.org/10.2472/jsms.58.948>
3. 中性子応力測定の新展開, 鈴木裕士, 秋田貢一, Vol.58, No.12, pp.1051-1057.
<https://doi.org/10.2472/jsms.58.1051>

2015年:「2次元検出器を用いた応力測定法の現状と今後の展開」

1. 2次元検出器を用いた応力測定法の現状, 坂井田喜久, Vol.64, No.7, pp.599-605.
<https://doi.org/10.2472/jsms.64.599>
2. 放射光を利用した2次元検出器による応力評価の最前線, 鈴木賢治, 菖蒲敬久, Vol.64, No.8, pp.675-681.
<https://doi.org/10.2472/jsms.64.675>
3. 2次元検出器を用いた応力測定法の課題と展望, 坂井田喜久, 栗村隆之, Vol.64, No.9, pp.745-750.
<https://doi.org/10.2472/jsms.64.745>

2020年:「X線回折ラインプロファイル解析による微視組織評価法」

1. ラインプロファイル解析の概要, 熊谷 正芳, 横山 亮一, Vol. 69, No. 3, pp. 277-283.

<https://doi.org/10.2472/jsms.69.277>

2. 放射光を用いたラインプロファイル解析, 菖蒲 敬久, 城 鮎美, 吉田 裕, Vol. 69, No. 4, pp. 343-347.

<https://doi.org/10.2472/jsms.69.343>

3. ラインプロファイル解析の利用例, 西田 真之, 橋本 匡史, 熊谷 正芳, Vol. 69, No. 5, pp. 421-426.

<https://doi.org/10.2472/jsms.69.421>